

拉曼测试 操作步骤

开激光

POWER
ON

LASER
OFF

ON

DIODE
ON

SHUTTER
MICRO

SCANNER
ON

CAMERA
ON

LASER
ON

SHUTTER 1

SHUTTER 2

LASER INDICATOR

INTERLOCK INDICATOR

开机：钥匙转到
ON，激光拨到ON

HORIBA JOBIN YVON

测试范围调节

保存
.ngs
.txt

校准
峰位
调节

测试
拉曼

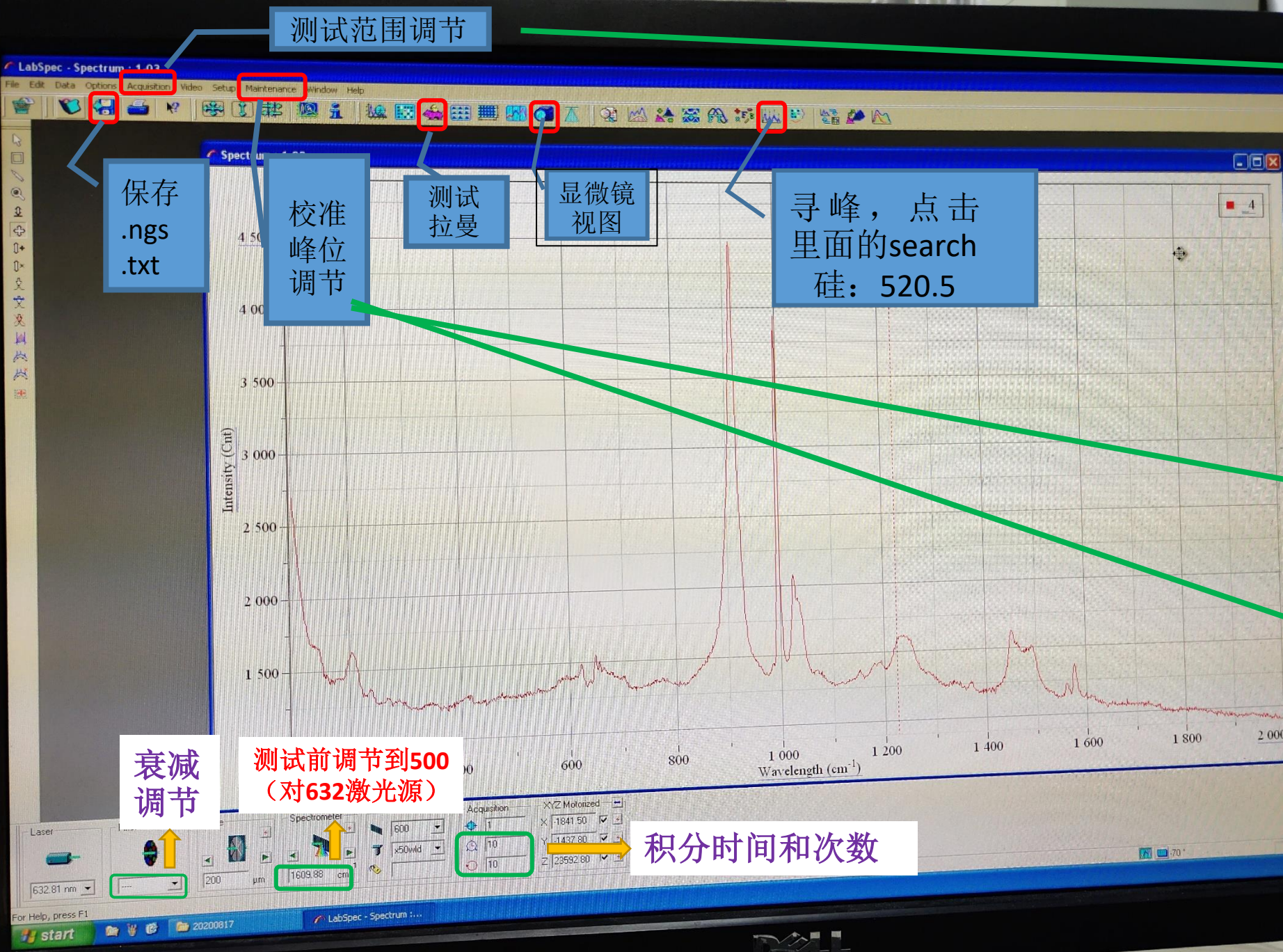
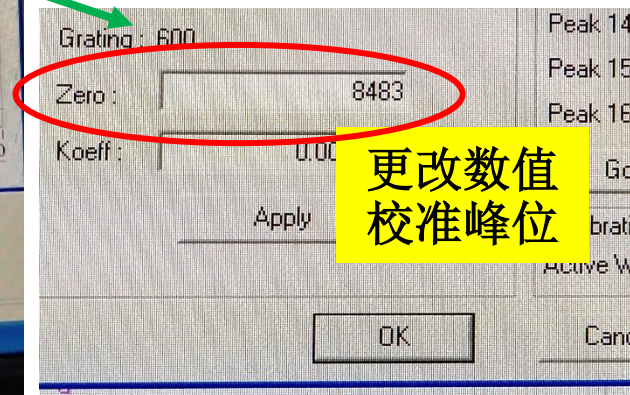
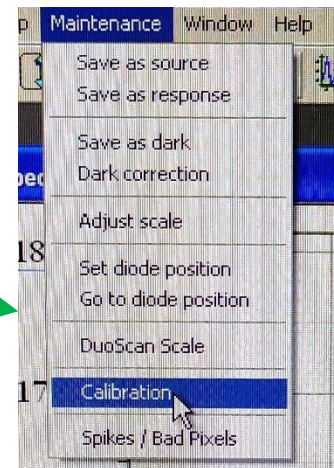
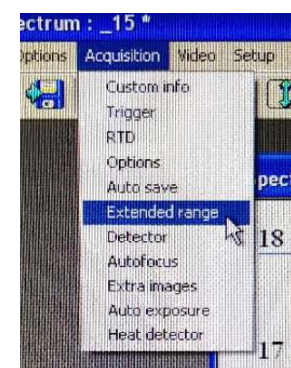
显微镜
视图

寻峰, 点击
里面的search
硅: 520.5

衰减
调节

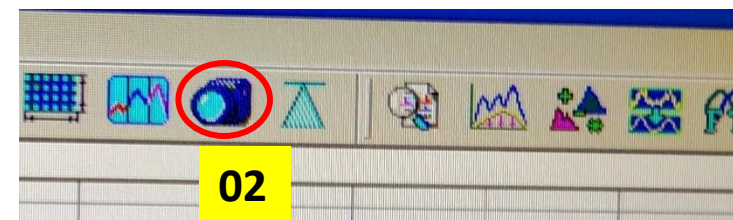
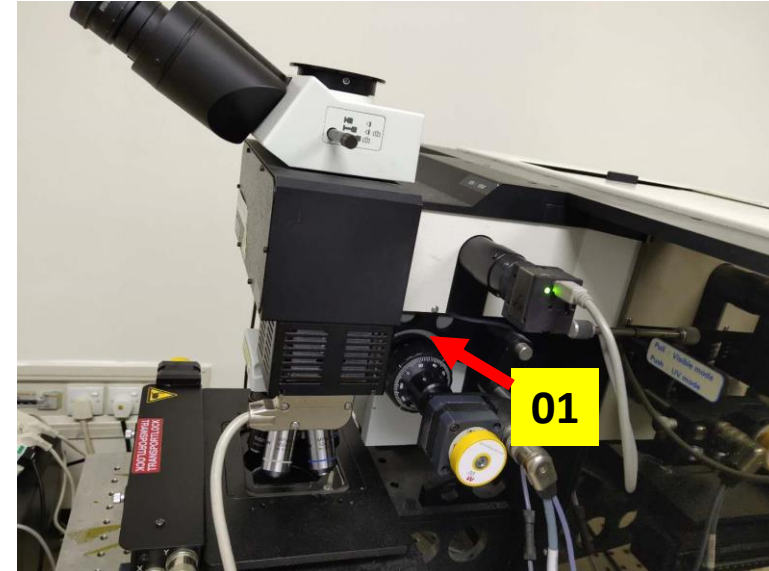
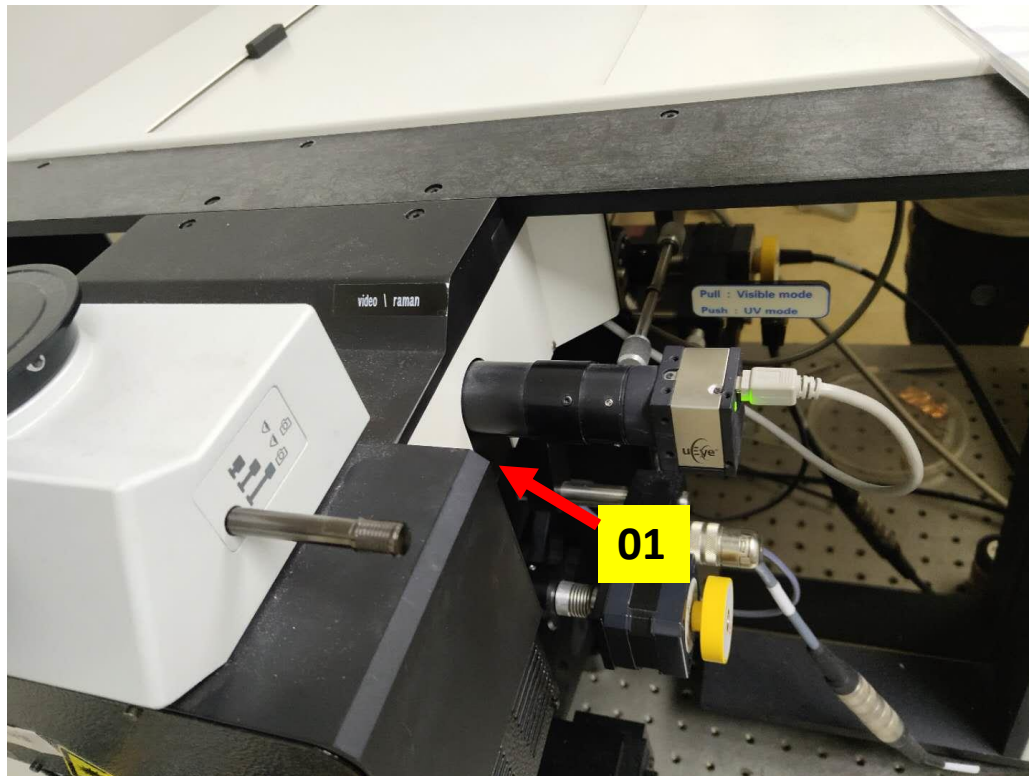
测试前调节到500
(对632激光源)

积分时间和次数



Si峰校准(520.5)

- ① 放硅片样品，将模式拨至Video（01，拨至朝里），点击屏幕02按钮，出现显微镜视图界面。
- ② 调节03合适光强，调焦（04、05）至呈现清晰物像。



05
旋转顶部
细调焦



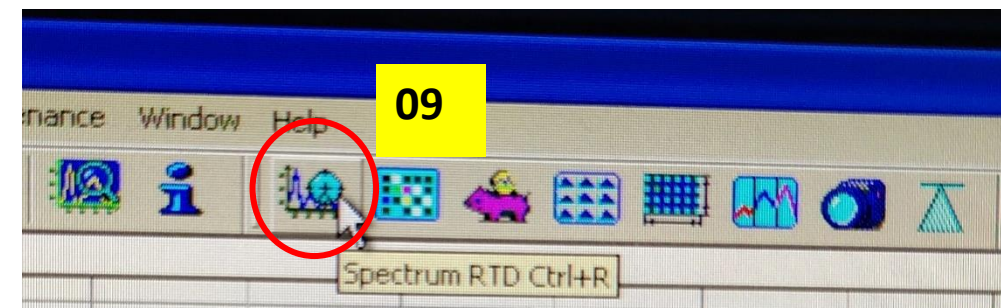
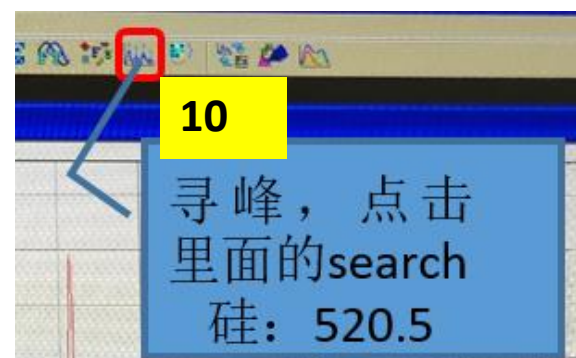
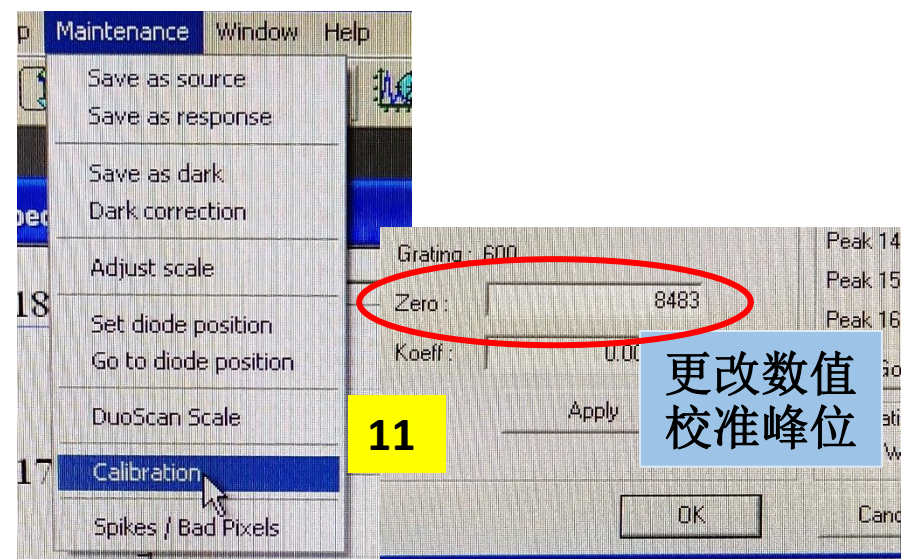
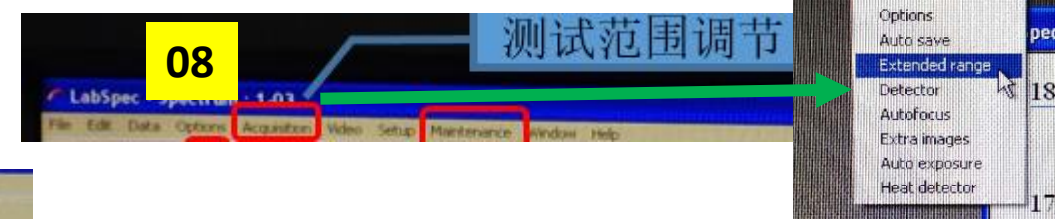
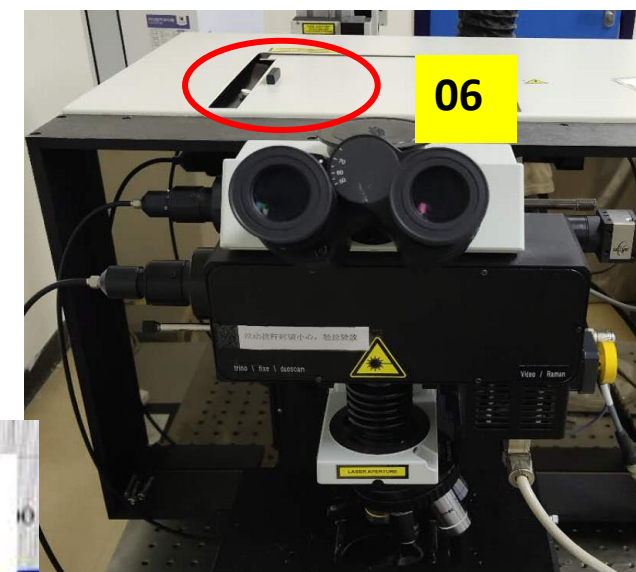
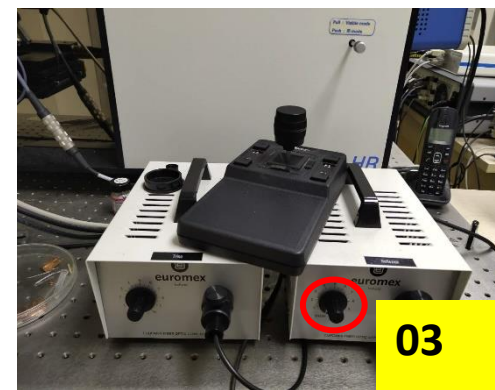
04
旋转粗调焦



03

Si峰校准(520.5)

- ① 放硅片样品，将模式拨至Video（01，拨至朝里），点击屏幕02按钮，出现显微镜视图界面。
- ② 调节03合适光强，调焦（04、05）至呈现清晰物像。
- ③ 旋转关闭03灯，将模式拨至Raman（01，拨至朝外），打开激光06(合上门即打开激光，开门即关闭激光)
- ④ 将位置调节至500 (对于632激光源)，如07，调节合适测试范围08
- ⑤ 点击09进行校准测试，出峰后停止，寻峰10，若峰位与520.5有差距，点击11，调节Zero值，点击下方OK，重复本⑤步骤，直至峰位达到520.5左右，校准完成。



Si峰校准(520.5)完成，进行样品测试。

- ① 关闭激光**06**(合上门即打开激光，开门即关闭激光)
- ② 将模式拨至Video (**01**, 拨至朝里)，放样品，点击屏幕**02**按钮，出现显微镜视图界面。
- ③ 调节**03**合适光强，调焦 (**04、05**) 至呈现清晰样品物像。
- ④ 旋转关闭**03**灯，将模式拨至Raman (**01**, 拨至朝外)，打开激光**06**(合上门即打开激光，开门即关闭激光)
- ⑤ 调节样品所需测试范围**08**，调节合适的积分时间和次数**12**。
- ⑥ 点击**13**进行拉曼测试
- ⑦ 保存数据**14**
- ⑧ 测试完成后，拷数据，关闭软件，关屏幕(电脑不关机)，关激光 (与开激光相反，即 *钥匙转到off*，*激光拨到off*)

